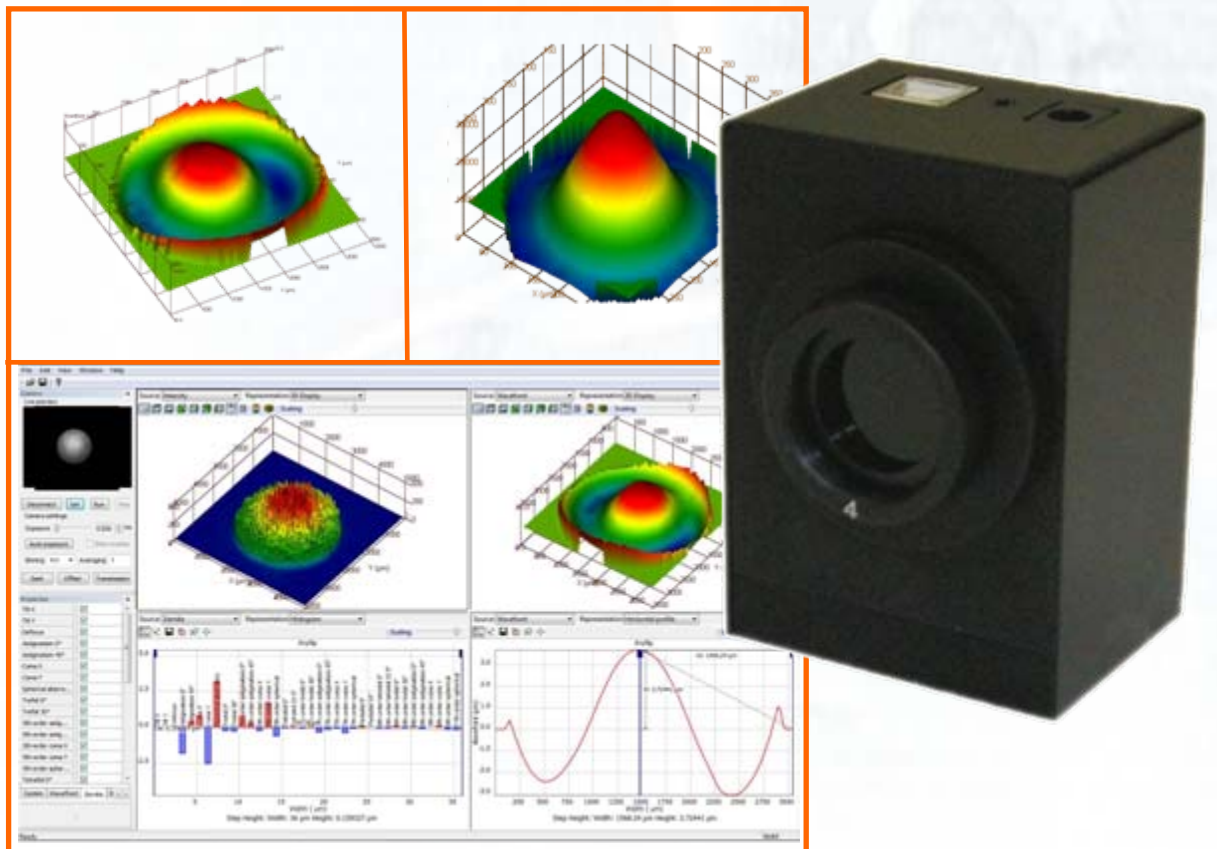


高分辨率 CCD 光束分析仪
即时光束传输与波阵面分析
单次对焦 M² 测量



经济智能的激光光束分析解决方案

利用最新进展的波阵面传感。紧凑和轻 BeamWave[®] 提供所有关键光束分析参数，
无需其它复杂、昂贵的设备。

多功能激光光束分析仪

无需其它额外配件, BeamWave® 可执行激光强度分布, 波阵面参数和光束测量传播参数的测量。

高分辨率的光束分析

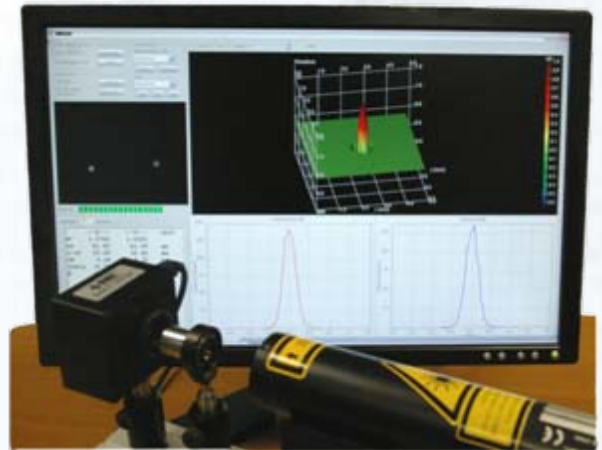
强度分布 • XY剖面 • 形心 •
发散角 • 非对称

BeamWave采用CCD脉冲和连续激光束探测器, 可提供准确的高动态和高分辨率的强度分析。

实时波阵面分析

Zernike 分析 • 低阶和高阶像差 • 散光

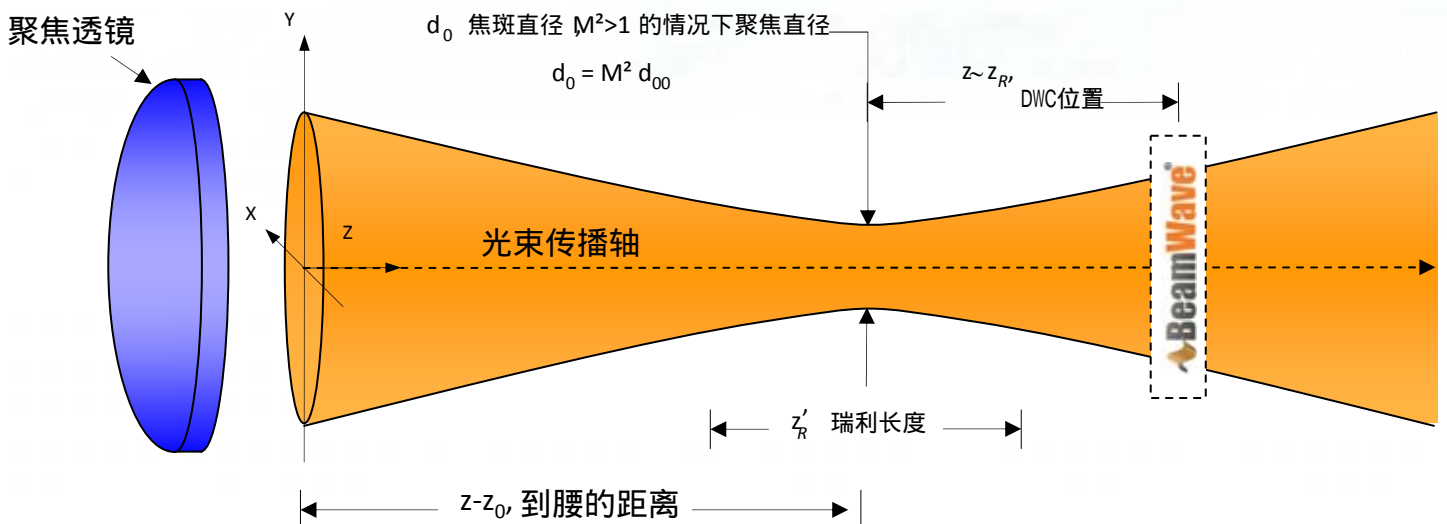
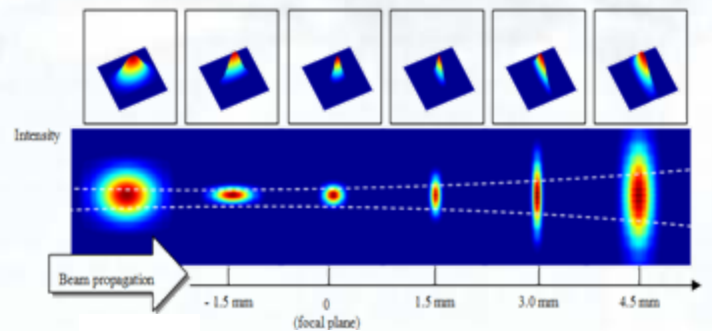
BeamWave提供高分辨率波阵面的数据, 这些有用的参数使得可以对激光束进行多角度分析。



光束传播参数测量

单次对焦 M^2 • 任意选择平面的强度分布
• 发散角 • 瑞利范围

由于它能同时进行相位和强度衡量, BeamWave提供光束传播分析, 从而提供了一个激光束沿的传播轴行为的即时画面。



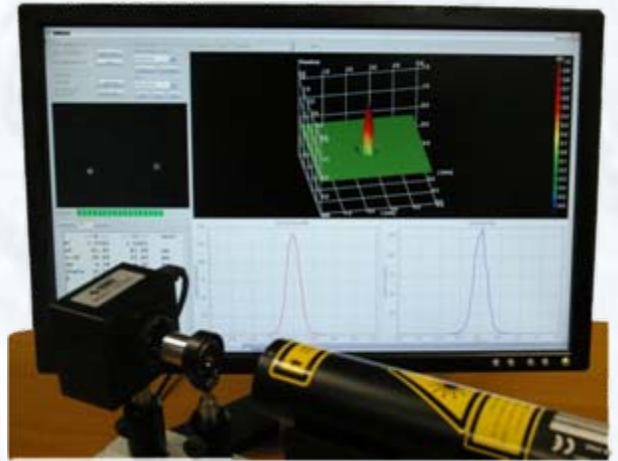
典型测量设置

多功能激光光束分析仪

单台仪器可测量激光束所有参数

在同一设备进行光束传输参数，相对功率密度，波阵面，并可在任何平面上的强度进行测量。

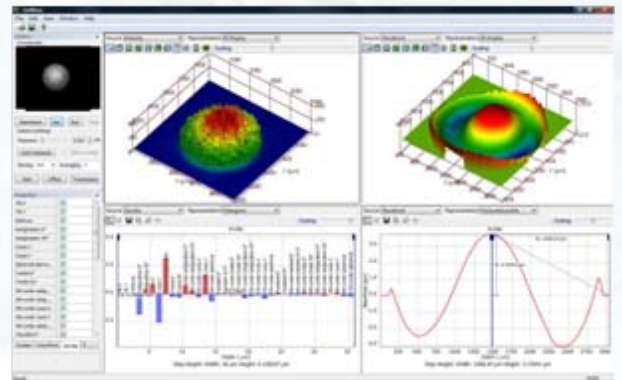
- 采用步进电机或移动平台自动测量
- 无运动设备的维修费用
- 使用仪器时无机械调整
- 无需复杂笨重测量系统，即可测量所有参数



高分辨率的强度和波阵面测量

CCD芯片上直接采集强度，由软件重建波阵面。

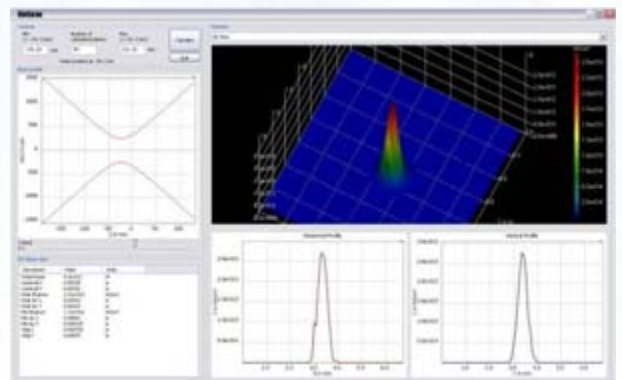
- 无需两个仪器（光束轮廓分析仪和波前传感器）可获得同一测量效果
- 在任意一个平面可对光束进行详细分析



对连续和脉冲激光进行单次聚焦 M^2 测量

M^2 对连续和脉冲激光束发散角，准直和其他传播参数是由软件计算的。

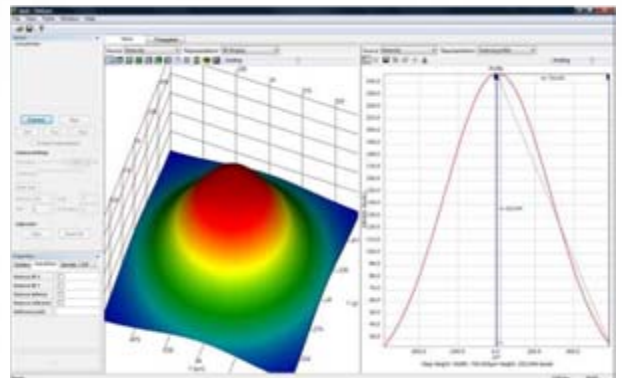
- 无需要额外的仪器，节省了时间和成本
- 量具有高度可重复性
- 可以对未对齐的激光进行测量



整个光束焦点区域周围广泛的即时测量

利用软件对光束传播同时进行强度和波阵面采集计算。

- 可以节省激光束调整的时间
- 可对激光束预测分析



多功能激光光束分析仪

GUI 软件兼容 XP, Vista and Windows 7, 展示出一个非常快速和简单的强度及波阵面采集方式, 并提供全面光束分析工具, 包括强度分布和光束传输参数。

- 采集 & 显示
 - 自动校准 & 采集
 - 即时显示波阵面的二维和三维强度, PSF
 - 单次和连续采集
 - 分析
 - 光束强度参数:
 - 最大强度级别
 - 椭圆的光束光点
- 主要和次要的光束点
 - 坐标轴维数
 - 光束传播参数:
 - M2 X 和Y 方向的参数
 - 4 在X和Y的腰围方向
 - 摄像机的位置和腰部平面之间的距离
 - 瑞利范围
 - 光束的发散角
 - PSF, 斯特列尔比
 - 实时 Zernike 显示和分析
 - 波阵面和强度分析
- 测试报告
 - 波阵面和Zernike数据
 - 报告编辑
 - 可兼容的HTML演示

技术参数

最大输入光束的直径($1/e^2$), mm	3.2
平面的测量	1
光束强度测量	连续和 脉冲激光在 XY 对任意 Z
波长范围(nm)	350 1100
测量 M^2	连续和脉冲激光
M^2 范围	1 to >50
M^2 精度	+/- 5%
M^2 重复性	< 2%
发散角/准直 测量的要求	无
是否可对相位/波阵面的测量?	是
波阵面和强度在XY分辨率, um	6.45
波阵面测量点	500 x 500 像素阵列
波阵面灵敏度 (), rms	0.01
波阵面精度 (), rms	0.02
波阵面动态范围 ()	1 500
测量时间	实时
计算机接口	USB 2.0
重量, kg	0.350
尺寸, mm	41 x 55 x 80



广州市固润电子科技有限公司